電子機器用固定コンデンサ―第20部：品種別通則：固定メタライズドポリフェニレンスルフィドフィルムチップ直流コンデンサ	C5101―20
電子機器用固定コンデンサ―第４部：品種別通則：アルミニウム固体及び非固体電解コンデンサ	C5101―４
電子機器用固定コンデンサ―第４部：ブランク個別規格：アルミニウム非固体電解コンデンサ　評価水準Ｅ	C5101―４―１
電子機器用固定コンデンサ―第４部：ブランク個別規格：アルミニウム固体電解コンデンサ　評価水準Ｅ	C5101―４―２
電子機器用固定抵抗器―第２部：品種別通則：低電力非巻線固定抵抗器	C5201―２
電子機器用固定抵抗器―第２部：ブランク個別規格：低電力非巻線固定抵抗器　評価水準Ｅ	C5201―２―１
電子機器用固定抵抗器―第２部：ブランク個別規格：低電力非巻線固定抵抗器　評価水準Ｆ	C5201―２―２
電子機器用固定抵抗器―第４部：品種別通則：電力形固定抵抗器	C5201―４
電子機器用固定抵抗器―第４部：ブランク個別規格：電力形固定抵抗器　評価水準Ｅ	C5201―４―１
電子機器用固定抵抗器―第４部：ブランク個別規格：電力形固定抵抗器　評価水準Ｆ	C5201―４―２
電子機器用固定抵抗器―第４部：ブランク個別規格：電力形固定抵抗器，ヒートシンク付き　評価水準Ｈ	C5201―４―３
電子機器用固定抵抗器―第５部：品種別通則：精密級固定抵抗器	C5201―５
電子機器用固定抵抗器―第５部：ブランク個別規格：精密級固定抵抗器　評価水準Ｅ	C5201―５―１
電子機器用固定抵抗器―第５部：ブランク個別規格：精密級固定抵抗器　評価水準Ｆ	C5201―５―２
電子機器用固定抵抗器―第６部：品種別通則：個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器	C5201―６
電子機器用固定抵抗器―第６部：ブランク個別規格：個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器　同一抵抗値及び同一定格電力　評価水準Ｅ	C5201―６―１
電子機器用固定抵抗器―第６部：ブランク個別規格：個別測定可能な固定ネットワーク抵抗器　異種抵抗値又は異種定格電力　評価水準Ｅ	C5201―６―２
電子機器用固定抵抗器―第８部：品種別通則：チップ固定抵抗器	C5201―８
電子機器用固定抵抗器―第８部：ブランク個別規格：チップ固定抵抗器　評価水準Ｅ	C5201―８―１
電子機器用可変抵抗器―第１部：品目別通則	C5260―１
電子機器用可変抵抗器―第２部：品種別通則：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器	C5260―２
電子機器用可変抵抗器―第２部：ブランク個別規格：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器　評価水準Ｅ	C5260―２―１
電子機器用可変抵抗器―第２部：ブランク個別規格：ねじ駆動形及び回転形半固定可変抵抗器　評価水準Ｆ	C5260―２―２
電子機器用可変抵抗器―第３部：品種別通則：回転形精密級可変抵抗器	C5260―３
電子機器用可変抵抗器―第３部：ブランク個別規格：回転形精密級可変抵抗器　評価水準Ｅ	C5260―３―１
電子機器用可変抵抗器―第４部：品種別通則：単回転電力形可変抵抗器	C5260―４
電子機器用可変抵抗器―第４部：ブランク個別規格：単回転電力形可変抵抗器　評価水準Ｅ	C5260―４―１
電子機器用可変抵抗器―第４部：ブランク個別規格：単回転電力形可変抵抗器　評価水準Ｆ	C5260―４―２
電子機器用可変抵抗器―第５部：品種別通則：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器	C5260―５
電子機器用可変抵抗器―第５部：ブランク個別規格：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器　評価水準Ｅ	C5260―５―１
電子機器用可変抵抗器―第５部：ブランク個別規格：単回転低電力形巻線及び非巻線可変抵抗器　評価水準Ｆ	C5260―５―２
電子機器用電源変圧器試験方法	C5311
電子機器用高周波コイル及び中間周波変成器通則	C5320
電子機器用高周波コイル及び中間周波変成器試験方法	C5321
低圧配電システムに接続するサージ防護デバイスの所要性能及び試験方法	C5381―１
低圧配電システムに接続するサージ防護デバイスの選定及び適用基準	C5381―12
通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイスの所要性能及び試験方法	C5381―21
低圧サージ防護デバイス用ガス入り放電管（ＧＤＴ）	C5381―311
低圧サージ防護デバイス用アバランシブレークダウンダイオード（ＡＢＤ）の試験方法	C5381―321
低圧サージ防護デバイス用サージ防護サイリスタ（ＴＳＳ）の試験方法	C5381―341
電子機器用コネクタ―第１部：品目別通則―能力認証	C5401―１
電子機器用コネクタ―第４部：品種別通則―プリント配線板用コネクタ―品質評価付	C5401―４
電子機器用コネクタ―第４―001部：プリント配線板用コネクタ―品質評価付―ブランク個別規格	C5401―４―001
電子機器用コネクタ試験方法	C5402
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第１―１部：一般試験―試験１ａ：外観	C5402―１―１
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第１―２部：一般試験―試験１ｂ：寸法及び質量	C5402―１―２
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―10部：耐候性試験―試験11ｊ：低温	C5402―11―10
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―11部：耐候性試験―試験11ｋ：減圧	C5402―11―11
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―12部：耐候性試験―試験11ｍ：温湿度サイクル	C5402―11―12
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―13部：耐候性試験―試験11ｎ：ガスタイト・無はんだラッピング接続	C5402―11―13
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―２部：耐候性試験―試験11ｂ：低温・減圧・湿度複合シーケンス	C5402―11―２
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―３部：耐候性試験―試験11ｃ：高温高湿（定常）	C5402―11―３
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―４部：耐候性試験―試験11ｄ：温度急変	C5402―11―４
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―５部：耐候性試験―試験11ｅ：かびの成長	C5402―11―５
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―６部：耐候性試験―試験11ｆ：腐食，塩水噴霧	C5402―11―６
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第11―９部：耐候性試験―試験11ｉ：高温	C5402―11―９
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第12―７部：はんだ付け試験―試験12ｇ：はんだ付け性，平衡法	C5402―12―７
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第２―１部：導通及び接触抵抗試験―試験２ａ：接触抵抗―ミリボルトレベル法	C5402―２―１
電子機器用コネクタ―試験及び測定―第２―３部：導通及び接触抵抗試験―試験２ｃ：接触抵抗の変動	C5402―２―３